

○ 鈴鹿工業高等専門学校受託試験取扱規則

令和元年 10 月 11 日
規則 第 114 号

鈴鹿工業高等専門学校受託試験取扱規則

(趣旨)

第 1 条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構受託試験取扱規則（独立行政法人国立高等専門学校機構規則第48号。以下「機構規則」という。）に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校（以下「本校」という。）における外部からの依頼に応じて行う試験、分析、鑑定等（以下「受託試験」という。）の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(受託試験基準)

第 2 条 受託試験は、教育研究上有意義であり、かつ、本校の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受託することができるものとする。

(受託試験手続)

第 3 条 受託試験を依頼しようとする者は、あらかじめ別紙様式 1 の申込書を本校校長に提出し、その承認を得なければならない。

(受託試験料)

第 4 条 直接経費としての受託試験料は、別表に定めるものとする。

2 間接経費として、別表に定める受託試験料の30%に相当する額を徴収するものとする。

3 別表に掲げる受託試験について、異なる額の料金を定めようとするとき及び別表に掲げる受託試験以外の試験について料金を定めようとするときは、本校校長へ別紙様式 2 により申請するとともに、機構規則第 4 条第 2 項の定めにより、理事長の承認を得るものとする。

(受託試験料の納付時期及び方法)

第 5 条 第 3 条の承認を得た者は、前条の受託試験料を法令等又は契約に定めのある場合を除き、原則、試験開始の前に納付するものとし、納付の方法は、銀行振込みによるものとする。

2 一旦納付された料金は、受託者の都合により承認を取り消した場合以外は還付しない。

附 則

この規則は、令和元年10月11日から施行する。

別紙様式 1

受 託 試 験 申 込 書

(元号) 年 月 日

鈴鹿工業高等専門学校長 殿

委託者 住所
氏名 印

下記のとおり試験をお願いいたします。

記

- 1 . 委託しようとする試験名

- 2 . 試験の数量、規格等

- 3 . 試験結果証明書（報告書）の必要の有無

- 4 . 実施場所

受 託 試 験 追 加 申 請 書

(元号) 年 月 日

鈴鹿工業高等専門学校長 殿

教職員 役職
氏名

印

下記のとおり、鈴鹿工業高等専門学校受託試験取扱規則第 4 条第 3 項により申請します。

記

- 1 . 別表に追加しようとする受託試験名

- 2 . 受託試験の単位、受託試験に使用する研究設備等

- 3 . 受託試験実施場所

- 4 . その他追記事項

別 表

受 託 試 験 料 金

番号	受託試験名	試験単位	試験料金(円)	備 考
1	3Dスキャン(3Dスキャナ EinScan-Pro)	1計測	13,400	
2	平面二軸引張疲労試験(大型二軸加振器)	1試験(1本)	12,400	
3	赤外線サーモグラフィによる表面温度計測(赤外線サーモグラフィ -20~500℃, 有効表示画素数320×240)	1視野画像 (5枚)	10,400	
4	表面張力計測(表面張力計 CBVP-A3)	1サンプル (5回計測)	8,400	
5	SPM観察(SPM-9700)	1視野	24,400	
6	太陽電池評価試験(分光計器 OTENTO-SUN II (AM1.5、100mW/cm ²)、 光量調整検知器 Si用および色素増感用、I-V測定システム keithley 2601B)	1試験(1回)	15,400	
7	※1 アークプラズマ蒸着試験(アークプラズマ蒸着装置 APD-2S-HEAT)	1試料(1個)	14,200	1時間あたり単価
8	※1 振動研磨試験(振動研磨機 GIGA-0900)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
9	※1 ガスクロマトグラフ質量分析試験 (ガスクロマトグラフ質量分析装置 GC-14A PSF)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価
10	真空リーク試験(ヘリウムリークディテクタ V-12)	1試験	8,200	1時間あたり単価
11	※1 疲労強度測定試験(疲労試験機 EHF-LV010 k 2-A04)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
12	BID式ガス分析試験(BID式ガスクロマトグラフ GC-2014AFSC)	1試験	12,200	1時間あたり単価
13	FID式ガス分析試験(FID式ガスクロマトグラフ GC-2014AFSC)	1試験	5,200	1時間あたり単価
14	TCD式ガス分析試験(TCD式ガスクロマトグラフ GC-2014AFSC)	1試験	4,200	1時間あたり単価
15	水素透過能測定試験(水素透過試験装置 YH-300XX)	1試験	8,200	1時間あたり単価
16	※1 雰囲気制御熱処理試験(雰囲気制御熱処理炉 ARF-50KC)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
17	※1 熱処理試験(熱処理炉 NAF-361-63型)	1試料(1個)	4,200	1時間あたり単価
18	※1 恒温熱処理試験(恒温炉 MDS-19SU)	1試料(1個)	4,200	1時間あたり単価
19	ガス吸着量測定試験(ガス吸着測定装置 QL-SG01-100-1A外)	1試験	8,200	1時間あたり単価

別 表

受 託 試 験 料 金

番号	受託試験名	試験単位	試験料金(円)	備 考
20	昇温脱離試験(昇温脱離測定装置 DKM300)	1試験	8,200	1時間あたり単価
21	気相触媒反応試験(気相触媒反応測定装置)	1試験	8,200	1時間あたり単価
22	液相触媒反応試験(液相触媒反応測定装置)	1試験	8,200	1時間あたり単価
23	ガス吸着FT-IR測定試験(ガス吸着FT-IR測定装置 FT/IR-4200)	1試験	8,200	1時間あたり単価
24	※1 高温・高圧オートクレーブ試験(オートクレーブ LSX-500)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
25	※1 紫外線硬化式3次元造形試験(紫外線硬化式3次元プリンタ Blade-1)	1試料(1回)	4,200	1時間あたり単価
26	※1 バイオフィーム加速形成試験 (バイオフィーム加速形成試験機 SN-NGN02外)	1試料(1個)	9,200	1時間あたり単価
27	※1 水晶振動子測定試験(水晶振動子測定装置 HQ304-C)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価
28	※1 電気化学測定試験(電気化学測定装置)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価
29	レーザー加工試験(レーザー加工機 VersaLASER VLS2.30)	1試料(1回)	6,200	1時間あたり単価
30	※1 紫外-可視-近赤外吸収分光分析試験 (紫外-可視-近赤外吸収分光計 V-670)	1試料(1個)	7,200	1時間あたり単価
31	※1 蛍光分光分析試験(蛍光分光計 CS260-USB-3-MC-D-CUS)	1試料(1個)	7,200	1時間あたり単価
32	※1 熱重量示差熱測定試験 (熱重量示差熱測定装置 ThermoPlus2)	1試料(1個)	14,200	1時間あたり単価
33	※1 示差走査熱量測定試験(示差走査熱量測定装置 ThermoPlusEVOII-ns)	1試料(1個)	14,200	1時間あたり単価
34	※1 熱膨張量測定試験(熱膨張量測定装置 KD-5)	1試料(1個)	14,200	1時間あたり単価
35	※1 3次元実態顕微鏡観察試験(実態顕微鏡観察装置 DXM1200F)	1試料(1個)	14,200	1時間あたり単価
36	※1 光学顕微鏡観察試験(光学式顕微鏡装置 LK-1500V)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
37	※1 組織観察用試料作製試験(回転式試料研磨装置 56-9111)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価
38	※1 ビッカース硬さ試験(ビッカース硬さ試験装置 HM-103)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
39	※1 ロックウェル硬さ試験(ロックウェル硬さ試験装置)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価

別 表

受 託 試 験 料 金

番号	受託試験名	試験単位	試験料金(円)	備 考
40	※1 シャルピー衝撃試験(シャルピー衝撃試験装置 CIEM-30-D)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価
41	※1 放電加工試験(放電加工機 EDM3G)	1試料(1個)	8,200	1時間あたり単価
42	※1 引張・圧縮・曲げ試験(万能試験機 SC-5CS)	1試料(1個)	8,200	1時間あたり単価
43	※1 アーク溶解試験(アーク溶解炉 NAF-361-103型)	1試料(1個)	14,200	1時間あたり単価
44	※1 圧延試験(圧延機 S-DR-20型)	1試料(1個)	9,200	1時間あたり単価
45	※1 切断加工試験(ファインカッター MC-416YS)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
46	※1 鍛造試験(エアーハンマー)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
47	※1 走査電子顕微鏡観察試験(走査電子顕微鏡 TM-1000)	1試料(1個)	8,200	1時間あたり単価
48	※1 ※2 元素分析試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 TM-1000との組合せによる試験＞	1試料(1個)	10,200	1時間あたり単価 番号47と組合せ試験
49	※1 コールドFE走査電子顕微鏡観察試験(走査顕微鏡 S-4300-S)	1試料(1個)	24,200	1時間あたり単価
50	※1 ※2 元素分析試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 S-4300-Sとの組合せによる試験＞	1試料(1個)	11,000	1時間あたり単価 番号49と組合せ試験
51	※1 ショットキーFE走査電子顕微鏡観察試験(走査顕微鏡 NB5000)	1試料(1個)	24,200	1時間あたり単価
52	※1 ※2 元素分析試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 NB5000との組合せによる試験＞	1試料(1個)	34,200	1時間あたり単価 番号51と組合せ試験
53	※1 ※2 FIB加工観察試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 NB5000との組合せによる試験＞	1試料(1個)	34,200	1時間あたり単価 番号51と組合せ試験
54	※1 ※2 結晶方位解析試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 NB5000との組合せによる試験＞	1試料(1個)	34,200	1時間あたり単価 番号51と組合せ試験
55	※1 透過電子顕微鏡観察試験(透過電子顕微鏡 H-9000NAR)	1試料(1個)	24,200	1時間あたり単価
56	※1 オスミウムコーティング試験(オスミウムコーター Neoc-Pro)	1試料(1個)	7,200	1時間あたり単価
57	※1 カーボンコーティング試験(カーボンコーター CADE-4001MTK)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価
58	※1 金コーティング試験(金コーター IB-3型)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価
59	※1 平面アルゴンミリング試験(平面ミリング装置)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価

別 表

受 託 試 験 料 金

番号	受託試験名	試験単位	試験料金(円)	備 考
60	※1 断面アルゴンミリング試験(断面ミリング装置)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
61	※1 X線回折試験(X線回折測定装置 SmartLab-ns)	1試料(1個)	15,200	1時間あたり単価
62	※1 ※2 X線回折試験 ＜オプション: X線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞	1試料(1個)	25,200	1時間あたり単価 番号61と組合せ試験
63	※1 ※2 雰囲気・温度制御X線回折試験 ＜オプション: X線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞	1試料(1個)	25,200	1時間あたり単価 番号61と組合せ試験
64	※1 ※2 微小領域X線回折試験 ＜オプション: X線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞	1試料(1個)	25,200	1時間あたり単価 番号61と組合せ試験
65	※1 ※2 高分解能PB-Ge X線回折試験 ＜オプション: X線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞	1試料(1個)	25,200	1時間あたり単価 番号61と組合せ試験
66	※1 ※2 回転・傾斜X線回折試験 ＜オプション: X線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞	1試料(1個)	25,200	1時間あたり単価 番号61と組合せ試験
67	※1 紫外-可視-分光分析試験(紫外-可視-分光分析装置 UV-1800)	1試料(1個)	6,200	1時間あたり単価
68	※1 FT-IR測定試験(FT-IR測定試験)	1試料(1個)	8,200	1時間あたり単価
69	※1 顕微FT-IR測定試験(顕微FT-IR測定装置)	1試料(1個)	8,200	1時間あたり単価
70	※1 顕微ラマン測定試験(顕微ラマン測定装置)	1試料(1個)	14,200	1時間あたり単価
71	※1 2次元マッピング顕微ラマン測定試験(顕微ラマン測定装置 OLS4000)	1試料(1個)	14,200	1時間あたり単価
72	※1 表面粗さ測定試験(表面粗さ測定装置)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価
73	※1 蛍光X線元素分析試験(蛍光X線分析装置)	1試料(1個)	9,200	1時間あたり単価
74	※1 X線光電子分光分析試験(X線光電子分光分析装置)	1試料(1個)	10,200	1時間あたり単価
75	※1 高温熱処理試験(ヒーター式マッフル炉 THERMOPULS)	1試料(1個)	5,200	1時間あたり単価
76	※1 レーザー顕微鏡観察試験(共焦点レーザー顕微鏡 OLS4000)	1試料(1個)	16,200	1時間あたり単価

注1) ※1は、試験を実施する試料を追加することに、上記に定める受託試験料に加え、1試料あたり1,000円を別途徴収する。

注2) ※2は、他の関連する試験との組合せによることが望ましいものとして示しており、その組合せる試験ごとに料金を加算する。

注3) 間接経費として、上記受託試験料(追加する試験料を含む。)の30%に相当する額を別途徴収する。

注4) 消費税相当額として、上記受託試験料(追加する試験料を含む。)に間接経費を加えた額に対し、10%に相当する額を別途徴収する。